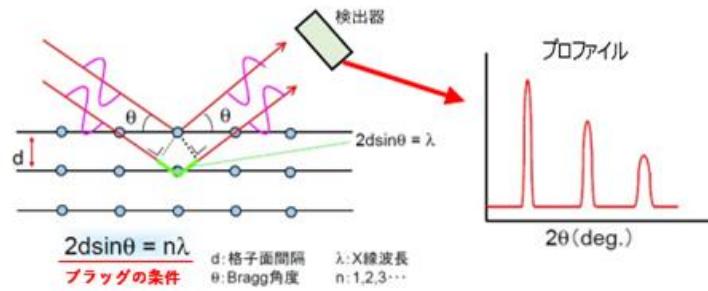


特徵

- ・結晶性を有する物質の同定、結晶構造の決定、結晶配向性の評価
 - ・同じ構成元素、化学式でも
結晶構造の違いを判別
 - ・さまざまな材料（金属、有機、無機）や
粉末、バルク、薄膜などに対応可

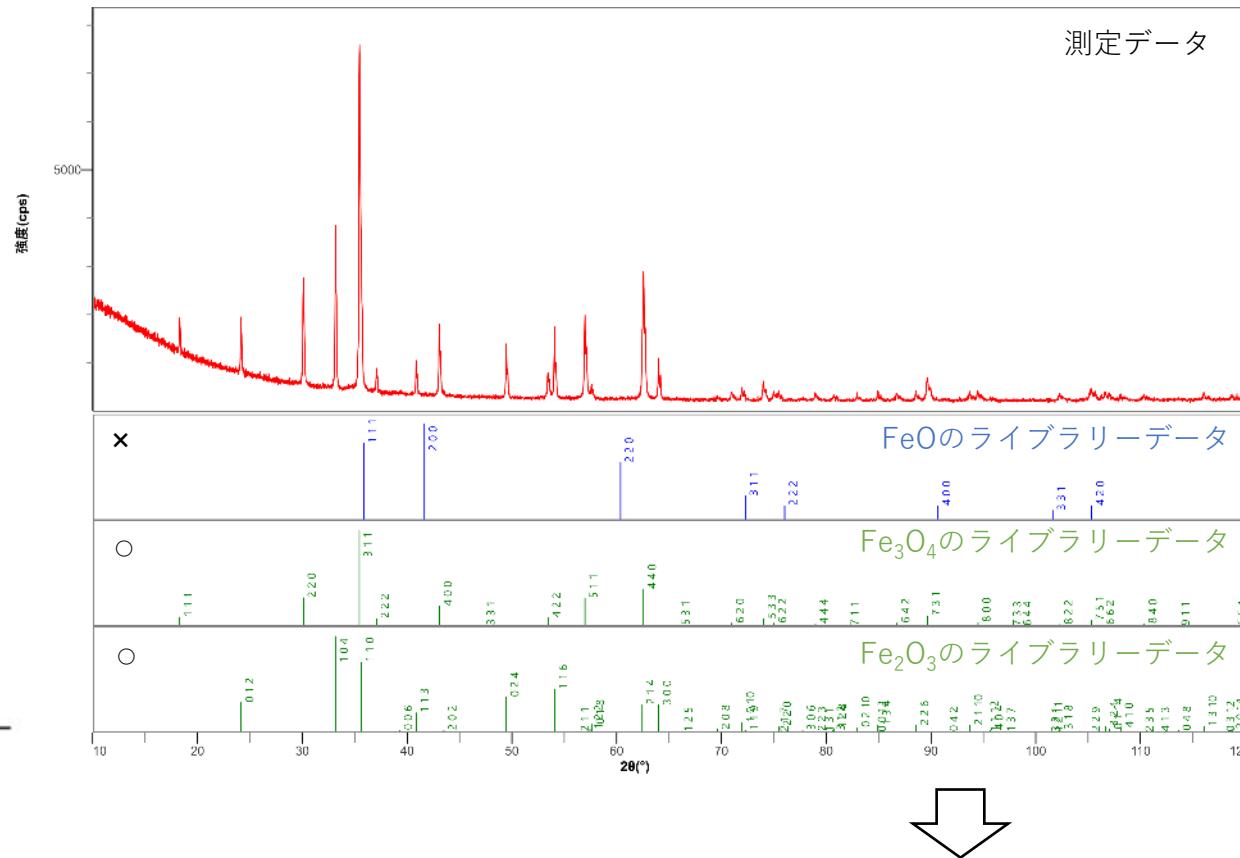
《測定原理》



結晶にX線を照射するとブレラグの条件を満たす角度に回折ピークが発生

⇒得られた回折パターンとデータベースの回折パターンを照合し、物質を同定

〈X線回折プロファイル〉



測定物質は Fe_3O_4 、 Fe_2O_3 と同定